thermoscientific

再重科技[®]ÜZONGLAB



Thermo Scientific Nexsa 表面分析系统 多技术集成型高性能 XPS



信心十足的分析

表面和界面分析充满了挑战性。需要能够为后续步骤研发改进提供可靠结果的仪器。Thermo Scientific™ Nexsa™ 表面分析系统是一种高性能 X 射线光电子能谱仪,在保证高效的数据质量和样品测试通量的同时,专门设计的多技术联合测试结合层平台。

高性能 XPS

● 全新设计的 X 射线源可以提供出色的灵敏度,以便于检测低浓度组分,同时具有适用于小型特征分析的微聚焦X束斑

多技术集成选项

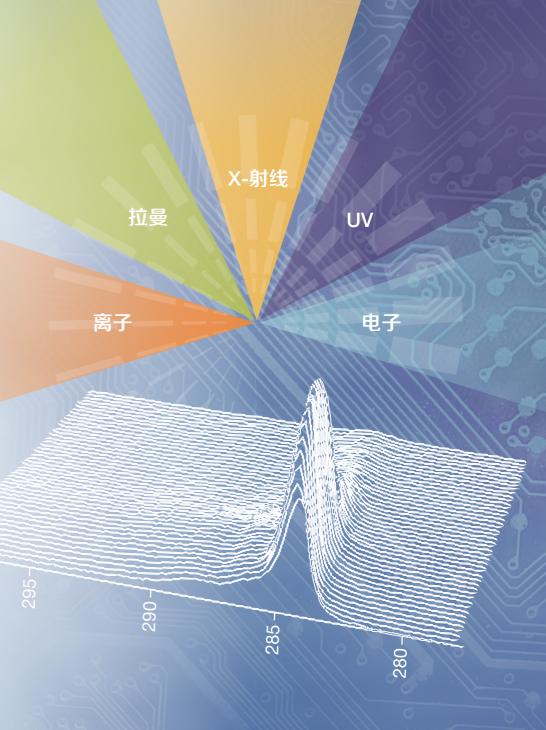
- UPS: 紫外光电子能谱
- REELS: 反射式电子能量损失谱
- ISS: 离子散射能谱
- 拉曼:利用 Thermo Scientific™ iXR™ 拉曼光谱仪分析分子键和结构信息

双模式离子源选项

Thermo Scientific[™] MAGCIS[™] 双模式离子源可扩大深度剖析应用

应用

电池 ■ 生物表面 ■ 催化剂 ■ 陶瓷 ■ 玻璃涂层 ■ 石墨烯 ■ 纳米材料 ■ OLED ■ 金属和氧化物 ■ 聚合物 ■ 太阳能电池半导体 ■ 薄膜



标准配置

微聚焦、单色化 $AI K-\alpha X$ 射线源 可在 $10-400 \mu m$ 的范围内调节

EX06 单粒子离子源 200 eV - 4 keV 离子能量

双束电子源可实现电荷补偿

拥有自动传输功能的快速进样 室,可实现快速放样

三重相机观察系统,可轻松 查找待分析特征

功能齐全的 Avantage 软件

升级选项

MAGCIS

以双模式单粒子和气体团 簇复合离子源替换 EX06

> 双极性分析器 适用于 ISS

紫外光源 适用于 UPS

高能量模式电子枪模式 适用于 REELS

真空传输模块

适用于空气敏感样品

倾斜模块 适用于 ARXPS 测量

样品偏差模块 适用于功函数测量



为什么选择 Nexsa?

快速的科研级能谱仪

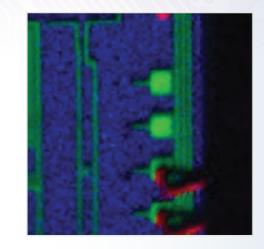
利用新型 X 射线单色仪,操作员可以以 $5~\mu m$ 步长选择 $10~\mu m$ 至 $400~\mu m$ 的 X 射线光斑,从而确保将分析区域调节成目标特征,并最大程度增大信号。利用高效电子透镜、半球形能量分析器和探测器,可实现绝佳的灵敏度和快速数据采集。

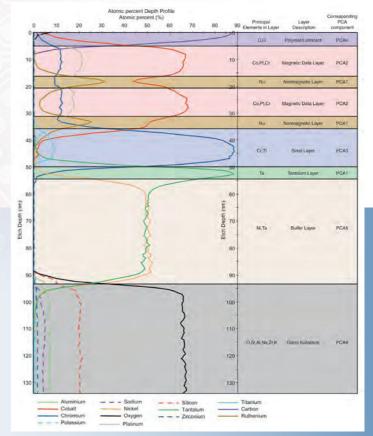
绝缘体分析

Nexsa 上的一键式自动化电荷补偿系统可轻松执行绝缘体分析。专利的双束电荷中和源避免绝缘样品发生荷电,因为使用极低能量电子,大多数情况下将不再需要进行电荷校正。

深度剖析

除表面分析外,Nexsa 还可利用标准离子源或 MAGCIS(可选的双模式单原子和气体团离子源)进行 深度剖析。自动离子源优化和自动气体处理可确保卓 越的性能和实验重现性。







- Si 氧化物
 W 氧化物
- Ti 氮化物
- Ti 氧化物
- Co 硅化物

XPS SnapMap

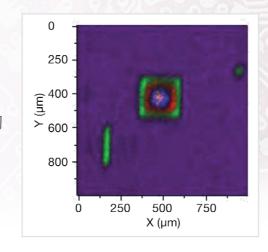
分析特征一目了然

要开始分析,您必须清楚目标区域。Nexsa 拥有一个独特的三重相机光学系统,有助于您快速查找目标区域,并将它们与分析位置对准。

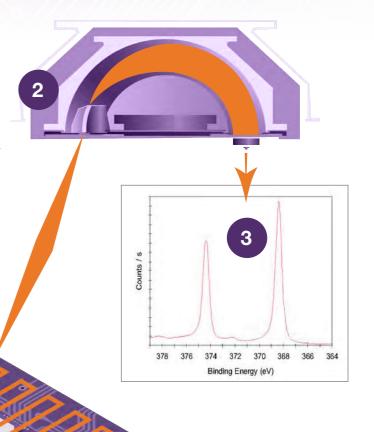
如果目标区域不容易看到,则可借助 XPS SnapMap 进行操作。SnapMap 快速成像功能可生成完全聚焦的 XPS 图像,用于定义实验。

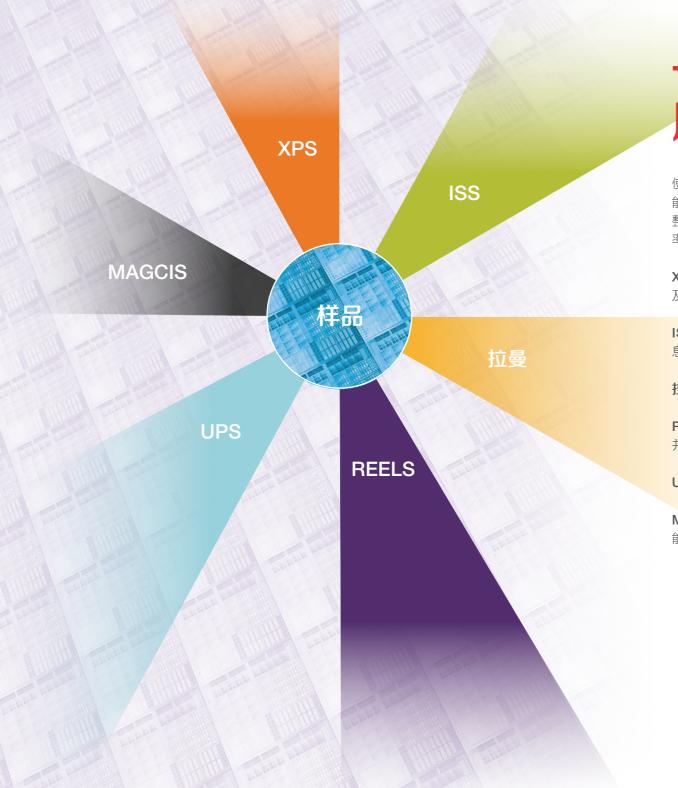
SnapMap 也可用于样品的采集和分析。用户可使用 Thermo Scientific™ Avantage™ 软件收集和处理数据,该软件包含生成元素化学态定量的所需的工具,包括主成分分析。

微聚焦 X 射线源与 SnapMap 样品台扫描相结合,用于保证灵敏度,确保整个图像中像素大小和焦点的一致性。简而言之,Nexsa 可为复杂的样品生成清晰的结果。



- 1 X 射线照亮样品上小区域
- 来自该小区域的光电子被收集并聚焦至分析器
- 3 随着样品台移动,可连续采集能谱
- 在整个数据采集过程中监控样品台位置,这些位置用于生成 SnapMap





一套系统分析你 所有的样品

使用 Nexsa, 所有技术将触手可及。标准配置包括高性能 XPS 所需的一切选项。升级选项可将系统转换为完整的分析工作站,有助于解决材料分析问题,提高生产率。

XPS: X 射线光电子能谱可提供样品表面的元素含量以及化学态信息

ISS: 离子散射能谱可提供最表面原子层的元素组成信

拉曼: 提供分子键和结构信息

REELS: 反射式电子能量损失谱可提供电子结构信息, 并检测氢元素的含量

UPS: 紫外光电子能谱可提供价电子信息

MAGCIS: 单粒子和气体团簇离子源可扩展深度剖析功能,从而能够分析如聚合物之类的"软质"层状材料

Avantage

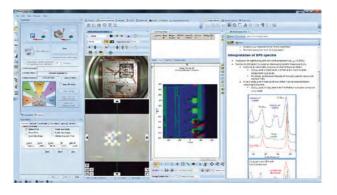
表面分析数据系统

现代 XPS 系统最重要的组件就是它的数据系统。与所有 Thermo Scientific XPS 系统一样,Nexsa 也利用 Avantage 进行仪器控制、数据处理和报告生成。无论是在专业的研究实验室,还是在多用户环境中工作,Avantage 都具有灵活易用、功能齐全、操作直观的特性,可帮助各种水平的用户最大程度地实现样品分析。



控制

从样品加载至系统那一刻起,Avantage 将处理所有仪器操作,直至进行数据采集。进样室将被抽空,并自动传输至分析室。转移样品所需的时间决于系统中所监控的压力,设定的时间可确保放气样品保持在进样室中,直到分析



准备就绪。Avantage 可监控所有系统参数,利用数据存储功能记录各个系统 组件的性能,并且能够通过一键式按钮自动校准 Nexsa。

采集

数据采集无比简单。从实时光学视图或者拼盘相机中设置分析点或线扫描,使用鼠标就可以设置分析区域,并匹配目标功能,接着通过元素周期表选择待分析元素,然后开始实验。很快便可将复杂的实验设置好开始运行。可将多个位置和试验类型(点、线、面、深度剖析)编程到同一个实验树中,从而对大型样品组进行长时间、无人值守的运行。软件中包含相当多的默认参数和自动分析程序,甚至可以利用系统帮助操作员制定数据分析策略,指导他们完成整个分析过程,直至生成报告。

分析

Avantage 拥有大量数据处理工具,可帮助用户最大程度地实现样品分析。从基本工具到必要图谱定量分析功能和高效分峰拟合程序,以及用于图像和深度剖析的复杂多元统计分析工具,Avantage 可满足各种水平用户的需求。在线交互Knowledge Base数据库可为谱图解析提供帮助,并利用对照谱图和峰值拟合图快速将数据生成结果。

报告

Avantage 包含一系列工具,可根据用户需求将数据输出为各种格式的报告。

Nexsa 表面分析系统



标准配置

微聚焦、单色化 X 射线源

双束中和源

单粒子离子源

分析选项

紫外光电子能谱

离子散射能谱

反射式电子能量损失谱

拉曼光谱

MAGCIS 双模式离子源

ARXPS 倾斜模块

真空传输模块

集成手套箱

详细信息请访问 thermofisher.com/surfaceanalysis

再重科技[®]ÜZONGLAB

成分分析仪器 | 表面测试仪器 | 样品前处理仪器

上海市闵行区春申路2525号芭洛商务大楼 电话: 021-8039 4499 传真: 021-5433 0867

上海|北京|沈阳|太原|长沙|广州|成都|青岛|香港 全国销售和售后服务电话:400-808-4598 邮编:201104 , China

邮箱:shanghai@uzong.cn

更多信息请访问:www.uzong.cn







微信公众号

Thermo Fisher